调谐外腔半导体激光器输出双稳环的确定*

陈建国 李 焱 李大义 陆 洋 (四川大学光电系,成都,610064)

摘要: 在考察了外腔半导体激光器(ECLD)的振荡频率ν与激光二极管(LD)中载流子密度 N (或增益 g)、介质的折射率 n 以及 LD 第 m 个模式的共振频率ν_m 间的关系之后,利用微扰法对 LD 的 *N*-ν 曲线上被前人错判为不稳定的两个关键区段重新进行了分析,结果表明这两个区段是 稳定区段,据此,可以确定在对 ECLD 进行调频的过程中其增益介质的 *N*-ν 曲线上出现的双稳环。 关键词: 双稳 外腔半导体激光器 微扰法

Determination of hysteresis loops for tunable external cavity semiconductor lasers

Chen Jianguo, Li Yan, Li Dayi, Lu Yang (Department of Optoelectronics, Sichuan University, Chengdu, 610064)

Abstract: Investigations have been made to determine relations between the oscillation frequency \mathcal{V} of the ECLD and threshold carrier density N(or gain coefficient g), refractive index n as well as mode frequency \mathcal{V}_m of the diode. Afterwards, the perturbation method has been adopted to check the stability of the state represented by the points on the N- \mathcal{V} curve. The results indicate that two segments of vital importance for the formation of the loop, which were formerly misjudged as representing non-stable states, represent stable state. Therefore, the hysteresis loop on the N- \mathcal{V} curve can be accomplished.

Key words: bistability external cavity semiconductor lasers perturbation method

引

言

外腔半导体激光器为研究光与物质相互作用提供了一个优良的系统。近年来,人们对强 反馈情况下调谐 ECLD 的双、多稳特性进行了不少的研究^[1~4]。实验观察和数值模拟证实: 由于 LD 的增益(或载流子密度)与折射率之间存在着相互依赖关系,在一定的情况下,调谐 ECLD的 *P*-V(输出功率 振荡频率)和 *P*-*I*(功率 电流)曲线上会出现双稳环;影响双稳环特性 的关键因子包括联系增益与折射率的谱线增宽因子 α ,外腔反馈 *R*₁和 LD 后端面(即靠近外 腔的那个端面)的反射率 *R*。

关于状态稳定性的问题,人们也进行了一些探讨。Zorabedian^[2] 曾对 *N*-*v*曲线上诸点所 代表的状态的稳定性进行了研究,其结论是:在强反馈情况下,*N*-*v*曲线上斜率小的那段代表 的状态是稳定的,大的那段是不稳定的。可惜作者没有意识到,其理论把 *N*-*v*曲线上两个具 有三解的区段中的关键部分误判为不稳定,这给构成双稳环带来了困难。Yan 等人^[4] 用扰动 的办法对稳定性进行了分析,其结论与 Zorabedian 的有相同之处,也有不同之处。另外,他们 也没有注意到所选择的参量使得 ECLD 在大部分频率区段处于失控状态,即激光器在事实上

^{*} 国家自然科学基金资助。

是处于 LD 单管振荡的状态,这就使人们不得不对作者的某些结论表示怀疑。在本文中,我们 首先研究了 ECLD 的振荡频率与 LD 的模式频率之间的关系,在此基础上进一步确立了各扰 动量之间的关系,之后用扰动法证明了 *N*-ν曲线上被错判的区段中有两个关键的小段在事实 上仍是稳定区段,据此,我们可以确定 *N*-ν曲线上的双稳环。

1 ECLD 的振荡频率与 LD 的模式频率

为了简化讨论,假设外腔长度可自动微调^[5]或光栅反馈的有限线宽使得 ECLD 可在反射 峰值附近自动选择一个满足位相条件的频率振荡^[3],于是我们可以集中讨论介质的载流子 (或增益)影响。如果外腔长度远远大于 LD 的长度 *L*,那么可以近似认为 ECLD 的振荡频率 连续可调。当 ECLD 被调在频率 *v*处振荡时,所需的阈值增益 *G(v*)应该满足^[5]:

 $G(\mathcal{V}) = \{ [R(1-R_1)^2 \cos^2 \Pi + (R_1-R)(1-RR_1)]^{1/2} - r(1-R_1) \cos \Pi / [r_2(R_1-R)] (1)$ 式中, r_2 为 LD 前端面的反射系数,本文中小写字母 r表示大写字母 R的平方根,它们分别表示端面反射系数和反射率, Π 为光线在 LD 中传播一周的相移, 即 $\Pi = 4\pi n(N) L \mathcal{V}(c)$ (2) 上式中, c为真空中的光速,折射率 n(N)与载流子密度的关系取为

$$n(N) = n_{\rm F} [1 - h(N - N_{\rm F})]$$
(3)

式中, N_F为某个参考载流子数密度,此时介质的折射率为_n, h 是一个正比于谱线增宽因子 a 的常数。

假设 ECLD 在 LD 增益峰附近振荡, 即介质增益对频率的微弱依赖关系可以忽略, 那么要 使 ECLD 在某个频率 ν 振荡所需的阈值载流子密度为 $N = N_0 + [\Sigma L + \ln G(\mathcal{V})]/(\alpha\Gamma L)$ (4) 式中, N_0 为透明载流子密度, ν 为损耗系数 α 是微分增益, Γ 为限制因子。研究表明, 当 ECLD被调在 LD 模式共振频率(比方说第 *m* 个模频)处振荡时, *N* 取极小值 N_M , 在 LD 模式 反共振频率振荡时, *N* 取极大值 N_X , 由(1) 式和(4)式可得:

$$N_{\rm M} = N_0 + \{ \ln[(1 + rr_1)/r_2/(r_1 + r)]/L + Y \} / (\alpha \Gamma)$$
(5a)

$$N_{\rm X} = N_0 4 \ln[(1 - rr_1)/r_2/(r_1 - r)]/L + \frac{\gamma}{(\alpha\Gamma)}$$
(5b)

在上述论断中,要注意的是、模频 v_m 是与载流子密度的选择有关的。因而,在 N 取 N_M 时, LD 第 m 个模式的模频(记作 v_{Mm})满足 $v_{Mm} = mc/[4\pi n(N_M)L]$ (6) 在本文中,模频下标的第一个字母(上式中为 M) 与确定该模频的载流子密度的下标相同。据 此,当 N 取 N_X 时,LD 的共振频率 v_{Xm} 与 v_{Mm} 是不同的。把 N_X 代入(3) 式中可以求得对应的 折射率,然后用 $n(N_X)$ 代替(6)式中的 $n(N_M)$ 就可求得 v_{Xm} 。综上所述,可以认为一旦 ECLD 的振荡频率确定以后,LD 中的载流子密度、折射率以及第 m 个模频也就随着确定了。从物理 的角度可以认为,ECLD振荡频率 v的变化使 LD 的模频改变,于是(1)式中的 n 亦随之而变。 这种考虑从数值计算角度看也是方便的,也正因为如此,目前见到的有关文献基本上都是用模 频作参考值来进行计算的。

为了方便研究,在本文中我们选定 $N_{\rm F} = (N_{\rm M} + N_{\rm X})/2$ (7) 对应的第 *m* 个模频 $V_{\rm Fm}$ 亦可由(6) 式定出。在较多的文献中^[2~4], LD 单管振荡阈值 N_T 被用 来确定折射率和模频。于是,在对测量结果进行解释的时候有一个参考点的转换问题,利用 (3) 式和(6) 式是不难解决的。把(7) 式代入(1) 式后可得 $K \cos \eta = \sinh [\alpha \Gamma L (N - N_{\rm F})]$ (8) 式中, $K = r(1 - R_1)/[(1 - RR_1)(R_1 - R)]^{1/2}$ (9) 在图 1 中, 我们画出了 ECLD 在不同频率振荡时 LD 中载流子密度变化的曲线。为了使该图具有一定的普适性, 纵座标表示参量 Z, 它与载流子密度的关系是 $Z = 2(N - N_F)/(N_X - N_M)$ (10)

作图时使用的参数包括: $R_1 = 0.1, R_2 = 0.3,$ $\Gamma = 0.3, n = 4.16, \alpha = 2.5 \times 10^{-16} \text{ cm}^2, \forall = 30 \text{ cm}^{-1},$ $N_0 = 1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}, c = 2.99 \times 10^{10} \text{ cm}/\text{ s}, L = 0.02 \text{ cm},$ $\alpha = 5, V_{Fm} = 2.3 \times 10^{14} \text{ Hz}$ (对应波长 1300nm),利用 上面参数可算得 $\Delta V = 1.8 \times 10^{11} \text{ Hz}$ 。



从图中可以看到, 表示 $N_{\rm M}$ 和 $N_{\rm X}$ 的水平线分 别与 $\mathcal{F}V$ 曲线相切于 P_m 和 Q_m , 下标 m 表示这两点属于 LD 的第 m 个模。据此, 我们还可以 在图中作出属于第(m-1) 个模的 $Q_{(m-1)}$ 点, 属于第(m+1) 模的 $P_{(n+1)}$ 点等。由于参量的 选择, 表示单管阈值载流子密度 N_1 的水平线高于表示 $N_{\rm X}$ (即 Z=1) 的水平线, 因而不出现在 图中。从前边的分析可知, P_m 点的座标是: $Z_{P_m} = -1$, $\mathcal{V}_m = \mathcal{V}_{\rm M}$. Q_m 点的座标是: $Z_{Q_m} = 1$, $\mathcal{V}_m = \mathcal{V}_{Xm} + \Delta \mathcal{V}_2$ 。这里, $\Delta \mathcal{V}$ 表示 LD 的模式间距, 可以近似当成常数。用 LD 的参数求得 $\Delta \mathcal{V}$ 之后, 可以在表示 $N_{\rm X}$ 的水平线上定出一个 T 点, 它代表的频率是 $\mathcal{V}_{\rm Xm}$ 。由(3) 式和(6) 式可 以证明: 当 ECLD 的振荡频率从 \mathcal{V}_m 变化到 \mathcal{V}_m 的过程中, LD 的第 m 个模式的频率将从 $\mathcal{V}_{\rm Mm}$ 开 始沿直线 $P_m T$ 变化到 T 点所代表的频率 $\mathcal{V}_{\rm Xm}$; 如果载流子密度真能够从 Q_m 点逐渐变化到 $P_{(m+1)}$ 点的话, 那么, LD 的第 m 个模式频率就会从 $\mathcal{V}_{\rm Xm}$ 开始沿直线 TP_m 返回到 $\mathcal{V}_{\rm Mm}$ 。

在图 1 中, 我们还示出了如何由 ECLD 的振荡频率(比方说 v_{osc})确定载流子密度 N_{osc} 及 LD 的第 m 个模式频率 v_{oscm} 。在知道 v_{osc} 后, 可以通过 v_{osc} 作垂线, 由它与 Z-v曲线的交点 U所代表的 Z 值定出对应的载流子密度 N_{osc} , 然后通过 U 点作水平线, 它与直线 $P_m T$ 的交点所 代表的频率就是 ECLD 在 v_{osc} 振荡时 LD 的第 m 个模式的频率。

2 双稳环的跳变点、

在 R 不大的情况下, ECLD 的阈值电流变化不大, 此时可近似认为输出功率的增加与载流子密度的减少成正比。因此, 我们研究 Z- ν 曲线上的双稳环就可以了。在文献[6]中, 我们曾研究过载流子密度的跳变点, 即图1中的A点和C点。在这两点处有 dV dN为 0, 由(1)式可求得这两点处的载流子密度 $N_{A,C}$ 满足:

$$N_{A,C} = \ln[W \pm (W^2 - 1)^{1/2}] / (2\alpha\Gamma L) + N_{\rm F}$$
(11)

式中.

$$W = 2(K^{2} + 1)/(\alpha^{2} + 1) - 1$$
(12)

于是, 由(8) 式可以求出在 A, C 两点处, 参量 几满足:

$$\sin^2 \eta_{4,C} = R_1 (1 - R)^2 / [R(1 + \alpha^2) (1 - R_1)^2]$$
(13)

文献[2],[4] 的研究表明,在 $Z-\nu$ 曲线上从 P_m 到 Q_m 这段代表的是稳定的状态,而从 Q_m 到 $P_{(m+1)}$ 这段代表的是不稳定的状态,这表明 C 到 $P_{(m+1)}$ 和从 Q_m 到A 这两小段的点代表 的状态是不稳定的(参照图 1)。从图 1 中可以看到,在这两段中,一个频率对应 3 个载流子密 度,因而如果其中两个状态不稳定,很难想象跳变点出现在这两个区段。同时,由于有 3 个解, 人们也很难想象 $P_{(m+1)}$ 和 Q_m 会是跳变点。看来,有必要重新考虑上边提到的两个区段的稳 定性。下边我们就用扰动法^[4]来分析这两个关键区段的稳定性问题。

假设某种扰动使得 LD 内的载流子密度变化了 δN_1 , 它将使折射率变化 δn_1 , 从而使 LD 的模式频率移动 δV_{m1} (或者等价的说, 参量 n 变化了 δn_1), 相应地 ECLD 振荡所需的增益改变 了 δG_1 。为了满足 δG_1 就需要载流子密度调整到另一个水平, 即变化量调整到 δN_2 。如此循 环下去, 载流子密度的增量将构成一个序列: δN_1 , δN_2 , δN_3 , ……。如果 $|\delta N_j/\delta N_{(j-1)}| < 1$ (此处 *j* 为正整数), 那么扰动就会逐渐消失, 对应的点应该是个稳定点^[4]。

利用(3)式可以求出 δN_1 引起的 δn_1 , 由(2)式定出相应的 $\delta \eta_1$, 通过(1)式找到对应的 δG_1 之后,最终我们可用(4)式得到 δN_2 。经过运算后,我们得到:

 $\delta N_2/\delta N_1 = -\alpha r(1 - R_1) \sin \Psi [R(1 - R_1)^2 \cos^2 \Pi + (R_1 - R)(1 - RR_1)]^{1/2}$ (14) 若要上式左端的绝对值小于 1, 可就应满足 $\sin^2 \Pi < R_1(1 - R)^2 / [R(1 + \alpha^2)(1 - R_1)^2]$ (15) 与(13) 式相比, 可以看出 *A*, *C* 两点正好是不稳定区段的起始点。换句话说就是: 在 *Z*-V 曲线 上, 从 *C* 到 $P_{(m+1)}$ 以及从 Q_m 到 *A* 这两个区段的点所代表的状态是稳定的。于是, 我们可以



Fig. 2 Variation of parameter Z with relative reflectivity R_1/R

说: *A* 点是载流子密度的下跳点(即功率上跳点), *C* 点是载流子密度的上跳点(即功率下跳点)。

在图 1 之后, 我们曾说过, 由于参量的选择, 表示 单管阈值(即 $Z = Z_n$)的水平线不会出现在图中。在 有些实验条件不, 比方说在 R_1 比 R 大不了多少时(文 献[4] 就属于这种情况), Z_T 就会落入图中。在 R 和 R^2 不变的情况下, N_T 不变。随着 R_1 向 R 靠近, N_X 迅速增加(当 R_1 等于 R 时 N_X 等于无穷大), 而 N_M 的下降有限, 于是造成了 Z_T 相对位置下降。当代表 Z_T 的水平线落入图中之后, 在该水平线与 Z_V 曲线之

间必然存在着交点。*Z*-*v* 曲线在该水平线之上的部分表示 ECLD 的阈值高于 LD 的单管阈值, 因而当光栅反射频率被调在相应区段时,外腔失控,激光器事实上是单管在振荡。Yan 等人^[4] 在水平线上面的区段找到一些稳定区是没有道理的。在图 2 中,我们画出了在 R = 0.01 时, Zx(x), Zr(点划线)和 $Z_M(虚线)$ 随 R_1/R 变化的曲线。计算中使用的其它参数与图 1 相 同。从图中可以看到,随 R_1 向 R 靠近,表示 Zr 的水平线逐渐向 Z_M 靠近,外腔能控制的频率 范围随之减小。此外,利用 N_M 和单管阈值的表达式可以证明,前者恒小于后者,因而 Z_M 始 终低于代表单管阈值的水平线。

考文献

- 1 Kakiuchida H, Ohtsubo J. IEEE J Q E, 1994; 30 (9): 2087
- 2 Zorabedian P. IEEE J Q E, 1994; 30 (7): 1542
- 3 Binder J, Cormack G D, Somani A. IEEE J Q E, 1990; 26 (7): 1191
- 4 Yan C, Wang X, M c In erney J G. IEEE J Q E, 1996; 32 (5): 813
- 5 Zhou X H , Chen J G , Lu Y C . Appl Opt, 1997; 36 (8) : 4138
- 6 Li Y, Chen J G, Li D Y et al. IEEE J Q E, 1999; 35(10): 1521

作者简介: 陈建国, 男, 1945 年出生。教授, 博士生导师。主要从事半导体激光器及光通信等方面的研究。